

Les étudiants d'Info Num Tours organisent le challenge de la veille

DATE(S)

le 31 janvier 2019

Le « Challenge de la Veille », créé en 2000 à l'IUT de Strasbourg, est un concours national qui met en compétition les étudiants de l'option « Information numérique des organisations » des DUT Information et Communication de différents IUT en France. Vainqueurs de l'édition 2018, les étudiants de Tours ont également gagné le plaisir d'organiser l'édition 2019.



Événement phare pour la promotion de cette option, le challenge de la veille est l'occasion pour les étudiants d'éprouver en situation réelle leurs compétences en matière de veille stratégique et de faire valoir les compétences

mobilisées acquises au cours de leur parcours d'études.

Chaque équipe challengeuse, composée de 5 étudiants au maximum, doit produire un livrable de veille : une note de synthèse de 10 pages en français, assortie d'annexes et d'une bibliographie analytique. C'est l'entreprise sponsor de l'événement qui définit le sujet, qui est dévoilé simultanément à tous les établissements participants. Cette année, l'entreprise STMicroelectronics, implantée à Tours depuis de nombreuses années, s'est engagée aux côtés des organisateurs comme partenaire principal en proposant le sujet :

“

« Comment faire connaître plus largement STMicroelectronics auprès du grand public français pour attirer les talents ? »

Le 31 janvier 2019, jour de la compétition, les équipes sélectionnées par leur IUT ont 15 minutes pour présenter les résultats de leur prestation face à un jury qui dispose à son tour de 10 minutes pour questionner et demander des précisions aux étudiants prestataires. Après délibérations, le jury annoncera l'équipe gagnante et ce sera alors l'heure des festivités pour finir de façon conviviale cette épreuve dense et enrichissante.

Merci à notre partenaire



e.augmente

À lire aussi

Run to(urs) School, un projet solidaire des étudiants de TC

25 ans du passeport culturel créé à l'IUT de Tours

Journée d'étude – « La question LGBTQ dans les séries. Étendue, normalisation, normativité »

[Haut de page](#)